

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-351967

(P2001-351967A)(43)公開日 平成13年12月21日(2001.12.21)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

H01L 21/68

21/31

H01L 21/68 21/31 P 5F031

B 5F045

審査請求 未請求 請求項の数20 OL 外国語出願 (全18頁)

(21)出願番号

特願2001-38834(P2001-38834)

(22)出願日

平成13年2月15日(2001.2.15)

(31)優先権主張番号 09/504288

(32)優先日

平成12年2月15日(2000, 2.15)

(33) 優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 390040660

アプライド マテリアルズ インコーポレ

イテッド

APPLIED MATERIALS, I

NCORPORATED

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 9505

4 サンタ クララ バウアーズ アベニ

ュー 3050

(72)発明者 ジョセフ ユドヴスキー

アメリカ合衆国, カリフォルニア州,

キャンベル, スモーキー コート 594

(74)代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (外2名)

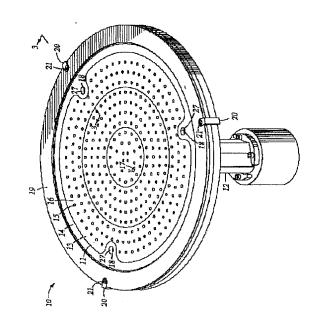
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】パージリング用締結装置

(57) 【要約】

【課題】 ペデスタル又はその他のシステム構成要素に 損傷を与えることなく、パージリングの垂直及び回転方 向の移動を抑制するパージリング及び取り外し可能な組 立体を提供する。

【解決手段】 締結装置は、パージリング19から退出 するパージガス又はその他の処理条件により生じるパー ジリング19の回転及び垂直方向の位置ずれを防止す る。この締結装置は、解放可能にパージリング19とウ ェハ支持部とを保持するクランプ20を有する。解放可 能にクランプ20を固定するために、パージリング1 9、ウェハ支持部、及びクランプ20を通じた孔にピン 21が差し込まれる。クランプ20の配置を導くため に、パージリング19にスロット22を形成できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パージガスを基板縁部へ送給する装置で あって、

基板受容面を画定する基板支持体と、

前記基板支持体に配置されるパージ部材と、

前記パージ部材と前記基板支持体との間に形成され、ガ ス源からパージガスを受け取り、このパージガスを前記 基板縁部へ送給するプレナムと、

前記パージ部材と前記基板支持体とを一緒に解放可能に 保持する締結具と、

を備える装置。

【請求項2】 前記締結具が、

少なくとも一つのクランプと、

少なくとも一つのクランプそれぞれのためのピンと、 を備え、

前記少なくとも一つのクランプと支持部材とパージ部材 とが、解放可能に前記ピンを受容するように形成された 孔を有し、

前記ピンが、前記少なくとも一つのクランプと支持部材 とパージ部材とを介して、前記孔に解放可能に挿通され 20 る請求項1に記載の装置。

【請求項3】 前記締結具が、

少なくとも一本のピン、

を備え、

前記支持部材とパージ部材とが、前記少なくとも一本の ピンを解放可能に受容するように形成された孔を有し、 前記少なくとも一本のピンが、前記支持部材とパージ部 材とを介して、解放可能に前記孔に挿通される請求項1 に記載の装置。

【請求項4】 前記締結具が、少なくとも一つのクラン 30 を備えるチャンバ。 プを備える請求項1に記載の装置。

【請求項5】 前記少なくとも一つのクランプ毎に前記 パージ部材に形成され、前記少なくとも一つのクランプ を解放可能に受容するスロットを更に備える請求項2に 記載の装置。

【請求項6】 前記基板支持体と、パージ部材と、少な くとも一つのクランプと、ピンとがセラミックから成る 請求項2に記載の装置。

【請求項7】 前記基板支持体が、基板支持体の上面か ら基板を持ち上げるリフトピンを更に含む請求項2に記 40 前記締結具が、更に 載の装置。

【請求項8】 前記パージ部材が、解放可能にシャドウ リングを受容する少なくとも一つの孔を有する請求項2 に記載の装置。

【請求項9】 前記基板支持体が、基板を望ましい温度 に維持するヒータ板として機能して基板支持体の内部に 配置されるヒータ要素を更に備える請求項2に記載の装 置。

【請求項10】 前記基板支持体が、基板支持体上面に 形成される真空ポートを更に備える請求項9に記載の装 50 腦。

【請求項11】 前記基板支持体が、

基板を支持するために基板上面に形成される突出部と、 真空ポートと連絡して基板支持体上面に形成される凹部

を更に備える請求項10に記載の装置。

【請求項12】 パージガスを基板縁部に送給する装置 であって、

基板受容面を画定する基板支持体と、

10 前記基板支持体に配置されるパージ部材と、

前記パージ部材と基板支持体との間に形成され、ガス源 からパージガスを受け取り前記基板縁部へ送給するプレ ナムと、

三つのクランプと、

三本のピンと、

を備え、

前記三つのクランプと支持部材とパージ部材とが、前記 三本のピンを解放可能に受容するように形成される孔を 有し、

前記三本のピンが、三つのクランプと支持部材とパージ 部材とを介して解放可能に前記孔に挿通される装置。

【請求項13】 基板を処理するチャンバであって、 基板受容面を画定する基板支持体と、

前記基板支持体に配置されるパージ部材と、

前記パージ部材と基板支持体との間に形成され、ガス源 からパージガスを受け取り基板縁部へ送給するプレナム

前記パージ部材と基板支持体とを一緒に解放可能に保持 する締結具と、

【請求項14】 前記締結具が、

少なくとも一つのクランプと、

少なくとも一つのクランプそれぞれのためのピンと、 を備え、

前記少なくとも一つのクランプと支持部材とパージ部材 とが、前記ピンを解放可能に受容するように形成される 孔を有し、

前記ピンが、少なくとも一つのクランプと支持部材とパ ージ部材とを介して、解放可能に孔に挿通され、

前記少なくとも一つのクランプ毎にパージ部材に形成さ れ、少なくとも一つのクランプを解放可能に受容するス ロットを備える請求項13のチャンバ。

【請求項15】 前記基板支持体が、ヒータペデスタル である請求項14のチャンバ。

【請求項16】 チャンバが化学蒸着チャンバである請 求項15のチャンバ。

【請求項17】 チャンバが更に高周波電源を備える請 求項16のチャンバ。

【請求項18】 前記ヒータペデスタルとパージ部材と

少なくとも一つのクランプと及びピンとが、セラミック から成る請求項17のチャンバ。

【請求項19】 チャンバがタングステンを堆積させる 請求項18のチャンバ。

【請求項20】 前記パージ部材が、シャドウリングを解放可能に受容するための少なくとも一つの孔を有する請求項14のチャンバ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体基板処理装 10 置の分野に関する。特に、本発明は、パージリング及び それに関連する締結装置に関する。

[0002]

【関連技術の背景】化学気相堆積(「CVD」)は、半 導体製造において、基板上に薄膜を堆積させるために使 用する一方法である。CVDでは、前駆ガスを真空チャ ンバ内及び基板上に送出し、ここでガスを反応させ、薄膜を形成する。基板上面での素材のCVDにおける一つ の問題は、素材が基板の端部及び裏面にも堆積すること である。基板の端部及び裏面は通常、十分に研磨された 20 上面より粗く、こうした表面に堆積する素材は剥離し て、チャンバ及びその中で処理される基板に損傷を与え る可能性のある粒子を形成しやすい。加えて、こうした 表面に堆積する素材は、基板を支持部材に固着させるこ とで、基板の完全性に損傷を与える恐れがある。

【0003】パージガスは、通常、支持部材を通じて基板の端部にパージガスを送出することで端部及び裏面の堆積を防止するために使用される。例えば、パージリングが、基板周囲に隣接する支持部材に配置される。このパージリングは、支持部材と共に環状のチャネルを形成 30 し、パージガスを基板縁部の方向へ向ける。パージガスは基板周辺部近くに正の圧力を加え、処理ガスが基板の端部及び裏面に到達する確率を減らす。

【0004】パージリングは、溶接、ボルト締め、又はネジ締め等の方法により、支持部材に固定して取り付けることができる。しかしながら、パージリング上及び環状チャネル内に素材が堆積するため、パージリングを容易に素早く洗浄又は交換できるように、取り外し可能なパージリングが好適である。パージリングは一般に、重力又は摩擦力により支持部材に保持される。取り外し可40能なパージリングは支持部材に固定して取り付けないため、パージガス又はその他の処理条件により、パージリングの垂直又は回転方向の位置ずれが発生し、端部/裏面の堆積、粒子の生成、及び基板縁部の損傷が生じる恐れがある。

【0005】パージリングの移動は、パージリングがセラミックのペデスタルと共に使用されている時、大きな問題となる。セラミックペデスタルは、高温での応用に使用され、これは、高温ではアルミニウムのペデスタルの腐食、バックスパッタリング、及び歪みが生じる可能 50

性があるためである。しかしながら、セラミックでの問題は、金属に比べて脆く、割れやすいことである。したがって、パージリングの移動により、セラミックペデスタルに損傷が生じ、システム内に粒子が形成される可能性がある。加えて、セラミック構成要素が割れる可能性とセラミック構成要素による作業に伴う困難とのため、溶接、ボルト締め、蝋付け、及びネジ締め等の一般的な接合装置によりパージリングをセラミックペデスタルに取り付けることはできない。

【0006】そのため、ペデスタル又はその他のシステム構成要素に損傷を与えることなく、パージリングの垂直及び回転方向の移動を抑制するパージリング及び取り外し可能組立体に関する必要性が存在する。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は一般に、パージリングと、このパージリングを取り外し可能な状態で基板支持体材に固定する締結装置とを有する基板支持体材を提供する。本発明の一実施形態において、この締結装置は、解放可能にパージリングを基板支持体材に取り付けるクランプを備える。この締結装置は更に、解放可能にクランプを支持部材に固定するピンを含むことができる。このピンは、パージリング、ウェハ支持部材、及びクランプを通じて孔に差し込まれる。パージリングには、クランプの配置を導くために形成されたスロットを含めることができる。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の前記特徴、利点、及び目的を達成し、詳細に理解し得るように、添付図面に例示された実施形態に基づき、先に概説した本発明を更に詳細に説明する。

【0009】しかしながら、本発明は他の同様に効果的な実施形態を許容し得るので、添付図面は本発明の代表的な実施形態のみを例示したものであり、その範囲を限定するものではないことに留意されたい。

【0010】本発明は一般に、締結装置を使用して支持 され取り付けられたパージリングを有する基板支持体材 を提供する。図1及び2は、本発明の一実施形態を全般 的に例示している。図1に示すように、この基板支持体 は、垂直可動ステム12上で支持される本体11を有す るヒータペデスタル10を備える。本体11は、基板支 持面14を定める上面13を有する。ヒータペデスタル 10の上面13と基板との間の熱伝導を促進するため に、基板は好ましくは真空を使用して上面13にチャッ ク又は密着させる。一般に、真空の分布を達成するため に、ヒータペデスタル10の上面13は、基板の支持に 適合する突出部分15と、真空ポート17を通じて導入 される真空から供給される真空との流体の連絡による定 圧部分をサポートするのに適合する凹部16とを含む。 ヒータペデスタル10は更にくぼみ27を含むことが可 能で、ここでは、動作始動組立体(図示しない)の動作

により垂直に移動するリフトピン18が基板を持ち上げ てヒータペデスタル10の上面13から離す。パージ部 材19は、ヒータペデスタル10の上で、基板支持面1 4の周囲に隣接して配置される。このパージ部材19に より形成されるパージガスチャネルについては、後に図 3において更に説明する。

【0011】C-クランプ20を備える締結装置は、解 放可能に、パージ部材19とヒータペデスタル10の本 体11との上に配置され、パージ部材19の垂直方向の 0、パージ部材19、及び本体11に差し込まれ、解放 可能にクランプ20を支持部材に固定する。このピン2 1により、クランプ20及びパージ部材19を容易に取 り外すことが可能になり、パージ部材19及びヒータペ デスタル10の洗浄又は交換が容易になり、これにより システムの生産性が増加する。更に、クランプ20及び ピン21をセラミック構成要素と共に使用することで、 ヒータペデスタル10及びパージ部材19が損傷を受け る可能性が減少する。好ましくは、パージ部材19は、 三個のクランプ20と3本のピン21を使用して本体に 20 固定される。加えて、図2に示すように、クランプ20 の配置のために、パージ部材19にスロット22を形成 できる。このスロット22により、クランプ20のアラ イメントが可能になり、パージ部材19の支持部材に対 する回転方向のずれを更に防止できる。

【0012】図3はヒータペデスタル10の端部の断面 図である。パージ部材19とヒータペデスタル10の本 体11とは、プレナム30を形成し、これは退出ギャッ プ31を通じて、基板支持面14の周辺部にパージガス を送る。本体11と、パージ部材19と、クランプ20 30 とは、解放可能に、パージ部材19の回転方向のずれを 防止するピン21を受容するために形成された孔32を 有する。スロット22は、クランプ20の配置のために 支持部材19に形成できる。又は、スロットは、本体1 1とパージ部材19との両方、又は本体11のみに形成 し、更にアラインメントを助け、パージ部材19の回転 を防止することができる。

【0013】ヒータペデスタル10と、パージ部材19 と、クランプ20と、ピン21とは、好ましくは、アル ミナ又はアルミナ窒化物等のセラミック素材で作製す る。前記構成要素は、同じセラミック素材で作製する必 要はないが、同様の熱膨張率を有するセラミック素材で 作製するべきである。セラミック素材は高温での使用に 最適である。CVDシステムにおいて、従来のアルミニ

ウム素材を使用することの問題の一部には、アルミニウ ムの腐食、温度制限、好ましくない堆積がある。プラズ マガスにより、アルミニウムの腐食が発生する恐れがあ り、これは装置内の金属汚染物に関連する処理の劣化に つながる。480℃より高い温度では、アルミニウムが 軟化し、歪みを生じる可能性があるため、アルミニウム は高温での使用には不適切な物質である。プラズマが存 在する状態で、約480℃より高い温度でアルミニウム が使用された時、アルミニウムはバックスパッタリング ずれを防止する。ピン21は、解放可能に、クランプ2 10 により、基板及びチャンバ構成要素を汚染する可能性が ある。したがって、本発明が最も適合する一応用例は、 高温でのタングステンのプラズマ増速CVDである。

> 【0014】本発明は、ペデスタル、パージリング、又 は基板に損傷を与えることなく、パージリングの移動を 防止する、信頼性が高く使い易い装置を提供する。以 上、本発明の好適な実施形態を説明してきたが、クラン プを備えた締結装置又はピンを備えた締結装置を非限定 的に含む、本発明の別の実施形態を案出することも可能 である。本発明の更に別の実施形態も本発明の基本的な 範囲から離れることなく案出し得るが、本発明の範囲は 前記特許請求の範囲により画定される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の装置の斜視図である。

【図2】図1の締結装置の分解斜視図である。

【図3】図1の線3-3に沿った締結装置の側断面図で ある。

【符号の説明】

10 … ヒートペデスタル

11 … 本体

12 … 垂直可動ステム

13 … 上面

14 … 基板支持面

15 … 突出部分

16 … 凹部

17 … 真空ポート

18 … リフトピン

19 … パージ部材

20 · C-クランプ

21 … ピン

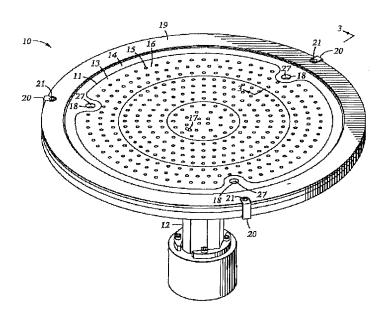
22 … スロット

30 … プレナム

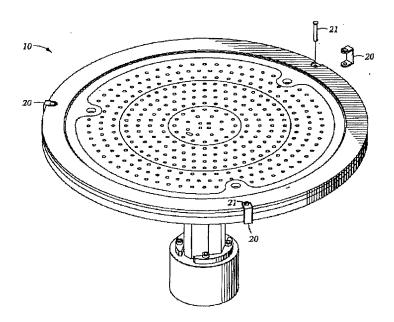
31 … 退出ギャップ

32 … 孔

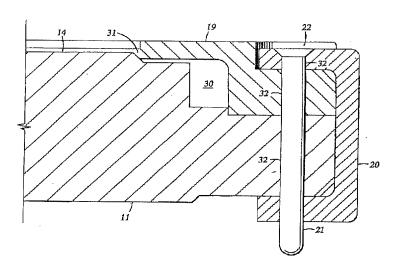
[図1]



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 サルヴァドール ユモトイ アメリカ合衆国, カリフォルニア州, アンティオキア, ワイルドフラワー ド ライヴ 2801

(72)発明者 ローレンス シー. レイ アメリカ合衆国, カリフォルニア州, ミルピタス, カントリー クラブ ドラ イヴ 1594 (72)発明者 ロナルド ローズ アメリカ合衆国, カリフォルニア州, サン ノゼ, パークウェル コート 112

F ターム(参考) 5F031 CA02 HA08 HA13 HA33 HA37 HA50 HA58 MA28 NA16 PA07 PA26 5F045 AA00 BB14 EM03 EM07

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-351967

(43) Date of publication of application: 21.12.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 H01L 21/31

(21)Application number: 2001-038834

(71)Applicant:

APPLIED MATERIALS INC

(22)Date of filing:

15.02.2001

(72)Inventor:

YUDOVSKY JOSEPH

UMOTOY SALVADOR

LEI LAWRENCE C

ROSE RONALD

(30)Priority

Priority number: 2000 504288

Priority date: 15.02.2000

Priority country: US

(54) FASTENING DEVICE FOR PURGE RING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a purge ring for suppressing vertical and rotational movements, without damaging the pedestal or another system constituent, and to provide an assembly which can be disassembled.

SOLUTION: The fastening device prevents rotational and vertical positions displacement of the purge ring 19, caused by purge gas leaving from the purge ring 19 or caused by other processing conditions. The fastening device comprises a clamp 20, which releasably holds the purge ring 19 together with a wafer support. A pin 21 is inserted into a bore through the purge ring 19, wafer support and the clamp 20 to releasably secure the clamp 20 in place. Slots 22 may be formed in the purge ring 19, for guiding placement of the clamp 20.

